

# 賞 状

優秀賞

森 博史 殿

## 画像生成システムのSPINを用いた設計検証

あなたは、並行処理に起因する不具合を検出するモデル検査技術の適用可能性の評価に取り組みました。業務で携わるシステムにおいて具体的な評価項目を定め、流用開発時における検査の有効性や、検査の所要時間に関する評価を行いました。業務における実際の課題を踏まえた活動であり、技術的にも検証項目の導出やモデルの抽象化など系統的な検討が行われています。以上を評価して優秀賞を与えることとします。

令和3年3月19日

国立情報学研究所 GRACE センター長  
早稲田大学理工学術院 教授